10/525952

(12) NACH DEM VERTRA BER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARD. AT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 25. März 2004 (25.03.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/025223 A3

(51) Internationale Patentklassifikation: G01D 1/00, G01N 27/416, 33/00, 27/417

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/009438

(22) Internationales Anmeldedatum:

26. August 2003 (26.08.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 39 610.8 29. August 2002 (29.08.2002) DI

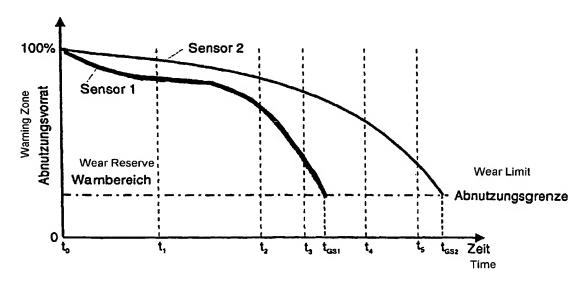
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ENDRESS + HAUSER CONDUCTA GMBH+CO. KG [DE/DE]; Dieselstrasse 24, 70839 Gerlingen (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WITTMER, Detlev [DE/DE]; Distelweg 34, 75433 Maulbronn (DE). STEIN-MÜLLER, Dirk [DE/DE]; Stettinerstrasse 21, 76139

Karlsruhe (DE). **FIKUS**, **Axel** [DE/DE]; Lauschka 18, 04746 Hartha (DE). **HAMMELEHLE**, **Wilfried** [DE/DE]; Ulrich-von-Hutten-Str. 17, 70825 Korntal-Münchingen (DE).

- (74) Anwalt: ANDRES, Angelika; Endress + Hauser Deutschland Holding GmbH, PatServe, Colmarer Strasse 6, 79576 Weil am Rhein (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD FOR MONITORING SENSOR FUNCTION
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR FUNKTIONSÜBERWACHUNG VON SENSOREN



(57) Abstract: The invention relates to a method for monitoring the function of sensors, for example electrochemical, electrophysical or optical sensors, used to measure and monitor condition parameters of liquids or gases, in particular in the field of process measurement technology. According to said method, the sensor is switched to a test mode at periodic intervals and test parameters are recorded, or said test parameters are recorded at periodic intervals in the course of the measured value recording process. The recorded parameters are stored and to monitor the function of the sensors a subsequent temporal progression of the stored test parameters is evaluated. The future progression of the expected sensor behaviour is predicted from said evaluation and information concerning the duration of the remaining faultless operation of the sensor is obtained.

WO 2004/025223 A3 III



TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 28. Oktober 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Funktionsüberwachung von Sensoren zur Messung und Überwachung von Zustandsparametern von Flüssigkeiten oder Gasen, insbesondere im Bereich der Prozessmesstechnik, beispielsweise von elektrochemischen, elektrophysikalischen oder optischen Sensoren, wobei der Sensor in zeitlichen Abständen in einen Prüfzustand versetzt wird und Prüfparameter erfasst werden oder diese Prüfparameter in zeitlichen Abständen im Zuge der Messwerterfassung erfasst werden, wobei die erfassten Parameter gespeichert werden und zur Durchführung der Funktionsüberwachung eine seitherige zeitliche Entwicklung der gespeicherten Prüfparameter ausgewertet wird und daraus die zukünftige zu erwartende Entwicklung des Sensorverhaltens vorhergesagt wird und Informationen über die Dauer des verbleibenden störungsfreien Betriebs des Sensors gewonnen werden.



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G01D1/00 G01N27/416 G01N33/00 G01N27/417

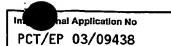
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search terms used)
PI Data, EPO-Internal		
ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.
30 July 1985 (1985-07-30) abstract; figure 6 column 1, line 51 -column 4, line	e 9	1–15
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 643 (P-1651), 29 November 1993 (1993-11-29) -& JP 05 209858 A (NGK INSULATORS 20 August 1993 (1993-08-20) abstract; figure 1; tables 1-3	S LTD),	1-5, 8-11,15
US 6 076 389 A (KANEKO MINORU) 20 June 2000 (2000-06-20) abstract; figure 1 column 1, line 49 -column 4, line	e 56	1,3,5, 7-9,11, 12,15
	-/	
ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
ategories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	"T" later document published after the interest or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or minerits, such combined with one or minerits, such combination being obvious in the art. "&" document member of the same patent	claimed invention t be considered to coment is taken alone claimed Invention ventive step when the ore other such docu- us to a person skilled
actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	rch report
31 August 2004	07/09/2004	
mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer Klein, M-0	
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant and the state of the state of the art which is not decument by upublished on or after the international date on the relevant defining the general state of the art which is not decoument by upublished on or after the international date and which may throw doubts on priority claim(s) or its cited to establish the publication date of another or or other special reason (as specified) ent which may throw doubts on priority claim(s) or its cited to establish the publication date of another or or other special reason (as specified) ent which may throw doubts on priority claim(s) or its cited to establish the publication date of another or or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed actual completion of the international filing date but han the priority date claimed actual completion of the international search 11 August 2004 mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NI. – 2280 HV Rijswijk Tel. (431-70) 340-2240, Tx. 31 651 epo ni,	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages US 4 532 013 A (DIETZ HERMANN ET AL) 30 July 1985 (1985–07–30) abstract; figure 6 column 1, line 51 —column 4, line 9 column 7, line 44 —column 8, line 53 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 643 (P-1651), 29 November 1993 (1993–11–29) —& JP 05 209858 A (NGK INSULATORS LTD), 20 August 1993 (1993–08–20) abstract; figure 1; tables 1–3 US 6 076 389 A (KANEKO MINORU) 20 June 2000 (2000–06–20) abstract; figure 1 column 1, line 49 —column 4, line 56 —/— her documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in the continuation of box C. The family members are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in the continuation of box C. The family members are listed in the continuation of box C. The family members are listed in the continuation of box C. The family members are listed in the continuation of box C. The family members are listed in the continuation of box C. The family members are listed in the continuation of box C. The family members are listed in the continuation of box C. The family members are listed in the continuation of box C. The family members are listed in the continuation of box C. The family members are listed in the continuation of box C. The family members are listed in the continuation of the continuation of the continuation of the continuation o





		PCT/EP 03/09438
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Sategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to daim No.
Х	WO 02/054056 A (METTLER TOLEDO GMBH; AMMANN JUERGEN (CH)) 11 July 2002 (2002-07-11) abstract; figures 4-7 page 3, line 12 -page 6, line 14; claims 1-16 page 12, line 16 -page 18, line 19	1,5,15
A	DE 42 21 848 A (FISCHER UWE PROF DR;SALZSIEDER ECKARD DR (DE)) 5 January 1994 (1994-01-05) the whole document	1-15
Α	US 5 273 640 A (KUSANAGI SIGEKAZU ET AL) 28 December 1993 (1993-12-28) the whole document	1-15
A	US 4 638 658 A (OTOBE YUTAKA) 27 January 1987 (1987-01-27) the whole document	1-15
		
		·
		·

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

INTERIORAL SEARCH REPORT

In hal Application No PCT/EP 03/09438

	atent document d in search report		Publication date		Patent family member(s)	1	Publication date
US	4532013	Α	30-07-1985	DE	3115404	A1	11-11-1982
			•	DE	3277135	Ð1	08-10-1987
;				EP	0067931	A2	29-12-1982
JP	05209858	A	20-08-1993	JP	2561754	B2	11-12-1996
US	6076389	A	20-06-2000	JP	11108878	A	23-04-1999
MO	02054056	A	11-07-2002	DE	10100239	A1	11-07-2002
				CN	1486424	T	31-03-2004
				EP	1350091	A1	08-10-2003
				WO	02054056	A1	11-07-2002
				US	2004068385	A1	08-04-2004
DE	4221848	Α	05-01-1994	DE	4221848	A1	05-01-1994
US	5273640	Α	28-12-1993	JP	2813424	B2 .	22-10-1998
			•	JP	4043952	Α	13-02-1992
				CH	683037	A5	31-12-1993
				DE	4118832		12-12-1991
				GB	2245711		08-01-1992
				JP	4230843		19-08-1992
UŞ	4638658	Α	27-01-1987	JP	1661913	С	19-05-1992
				JP	3028582	В	19-04-1991
				JP	61081541	Α	25-04-1986
				DE	3533287	A1 ·	27-03-1986

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G01D1/00 G01N27/416 G01N33/00

G01N27/417

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 G01N

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

PAJ, WPI Data, EPO-Internal

Kategorieº	Bezelchnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 4 532 013 A (DIETZ HERMANN ET AL) 30. Juli 1985 (1985-07-30) Zusammenfassung; Abbildung 6 Spalte 1, Zeile 51 -Spalte 4, Zeile 9 Spalte 7, Zeile 44 -Spalte 8, Zeile 53	1-15
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 643 (P-1651), 29. November 1993 (1993-11-29) -& JP 05 209858 A (NGK INSULATORS LTD), 20. August 1993 (1993-08-20) Zusammenfassung; Abbildung 1; Tabellen 1-3	1-5, 8-11,15
X	US 6 076 389 A (KANEKO MINORU) 20. Juni 2000 (2000-06-20) Zusammenfassung; Abbildung 1 Spalte 1, Zeile 49 -Spalte 4, Zeile 56	1,3,5, 7-9,11, 12,15

entnehmen entnehmen	Siehe Anhang Patentfamilie
ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der Ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
31. August 2004	07/09/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan-2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Klein, M-O



Ina na	les Aktenzelchen
PCT/EP	03/09438

•	11	CT/EP 03/09438	
C.(Fortsetzi	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		•
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht kommend	len Teile Setr. Anspr	ich Nr.
X	WO 02/054056 A (METTLER TOLEDO GMBH; AMMANN JUERGEN (CH)) 11. Juli 2002 (2002-07-11) Zusammenfassung; Abbildungen 4-7 Seite 3, Zeile 12 -Seite 6, Zeile 14; Ansprüche 1-16 Seite 12, Zeile 16 -Seite 18, Zeile 19	1,5	5,15
A	DE 42 21 848 A (FISCHER UWE PROF DR;SALZSIEDER ECKARD DR (DE)) 5. Januar 1994 (1994-01-05) das ganze Dokument	1-1	.5
A	US 5 273 640 A (KUSANAGI SIGEKAZU ET AL) 28. Dezember 1993 (1993-12-28) das ganze Dokument	1-1	.5
A	US 4 638 658 A (OTOBE YUTAKA) 27. Januar 1987 (1987-01-27) das ganze Dokument	1-3	5
			
			•
	,		

	lecherchenbericht artes Patentdokume	ent	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US	4532013	A	30-07-1985	DE DE EP	3115404 3277135 0067931	D1	11-11-1982 08-10-1987 29-12-1982
JP	05209858	A	20-08-1993	JP	2561754	B2	11-12-1996
US	6076389	A	20-06-2000	JP	11108878	A	23-04-1999
WO	02054056	A	11-07-2002	DE CN EP WO US	1486424		11-07-2002 31-03-2004 08-10-2003 11-07-2002 08-04-2004
DE	4221848	Α	05-01-1994	DE	4221848	A1	05-01-1994
US	5273640	A	28-12-1993	JP JP CH DE GB JP	4043952 683037 4118832	Al A ,B	22-10-1998 13-02-1992 31-12-1993 12-12-1991 08-01-1992 19-08-1992
US	4638658	A	27-01-1987	JP JP JP DE	1661913 3028582 61081541 3533287	B A	19-05-1992 19-04-1991 25-04-1986 27-03-1986